

Le système Micromesure 2 est l'outil idéal pour une mesure de topographie de surface sans contact, rugosité 3D, métrologie de forme et microtopographie 3D. Il est équipé d'un capteur confocal chromatique TopSens.

Système clé en main, la station Micromesure 2 comprend le système d'acquisition et le logiciel pour analyser vos mesures.



Hauteur de
marche



Rugosité



Planéité



Parallélisme



Tribologie



Avantages

- Mesure sans contact
- Tous matériaux
- Aucune préparation de l'échantillon
- Système entièrement automatisé
- Architecture modulaire
- Grande précision et rectitude

TopStation - Micromesure 2

Profilomètre optique automatisé

Fiche technique



Caractéristiques techniques

TopStation Micromesure 2		
Axes	X & Y	Z
Course max	300 mm	200 mm
Encodeur	Oui / Non	Oui
Précision de position	1 à 10 μm	1 μm
Résolution de position	0.1 μm	0.1 μm
Planéité	1 μm	1 μm
Vitesse Max	20 mm / s	5 mm / s

Capteurs TopSens & TopLine	
Plage de Mesure	100 μm à 100 mm
Résolution Axiale	5 nm à 30 μm
Angle de mesure	$\pm 2^\circ$ à $\pm 44^\circ$
Distance de travail	0.8 mm à 47.8 mm

Avantages

Mesure sur objet avec forte pente ou angle de courbure
 Mesure dimensionnelle sans contact
 Large choix de capteur disponible
 Résolution nanométrique et micrométrique
 Insensible à la lumière ambiante
 Mesure sur métal, verre, semi-conducteur, céramique...
 Mesure d'épaisseur et forme sur objet transparent
 Correction de l'orthogonalité et de la planéité



Applications

- Analyse de forme et texture
- Profilométrie et topographie de surface
- Contrôle état de surface
- Mesure de rugosité
- Contrôle dimensionnel

Options

- Tourelle multi-capteurs Topsens
- Axes X-Y motorisés
- Axes X&Y encodés pour meilleure précision
- Courses X, Y, Z ajustables
- Table anti-vibration
- Boîtier de protection pour environnements difficiles

